

各支援業務及び共用設備における利用料一覧

業務	共用設備 (メーカー名、型番)	利用料（円）（消費税を除く。）			試験単位等 (標準測定時間)
		（ ）内は、第12条第2項の規定に基づく特別の事情がある場合の利用料を示す。			
		学術研究機関	中小企業	大企業	
技術相談		無料			1 件あたり最初の 2 時間まで 10,000 円。相談時間を延長する場合は、延長 2 時間につき 15,000 円（技術相談は、原則として 1 日につき 1 回 2 時間までとする。）。 なお、上記以外に作業費が発生する場合は、実費を別途請求する。
技術代行	300kV透過電子顕微鏡 (300kV-TEM) (JEOL JEM-3100FEF)	37,500 (41,250)	75,000 (82,500)	112,500 (123,750)	1 検体 (4 時間以内)
	200kV透過電子顕微鏡 (200kV-TEM) (※1) (JEOL JEM-2200FS)	14,400 (15,840)	28,800 (31,680)	43,200 (47,520)	1 検体 (4 時間以内)
	走査透過電子顕微鏡 (STEM) (HITACHI HD-2700)	46,800 (51,480)	93,500 (102,850)	140,300 (154,330)	1 検体 (4 時間以内)
	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (HITACHI SU9000)	13,700 (15,070)	27,400 (30,140)	41,100 (45,210)	1 検体 (4 時間以内)
	低真空分析走査電子顕微鏡 (HITACHI SU6600)	9,700 (10,670)	19,400 (21,340)	29,100 (32,010)	1 検体 (4 時間以内)
	多機能分析走査電子顕微鏡 (JEOL IT800 (SHL))	13,700 (15,070)	27,400 (30,140)	41,100 (45,210)	1 検体 (4 時間以内)
	微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (HITACHI NE4000)	67,500 (74,250)	135,000 (148,500)	202,500 (222,750)	1 検体 (4 時間以内)
	走査プローブ顕微鏡 (SPM) (HITACHI SPA400)	2,700 (2,970)	5,300 (5,830)	8,000 (8,800)	1 検体 (2 時間以内)
	二重収束型質量分析計 (Sector) (※2、※3) (JEOL JMS-700 MStation)	2,000 (2,200)	4,000 (4,400)	6,000 (6,600)	1 検体 (1 時間以内)
	LC/TOFMS (※4) (JEOL JMS-T100LC AccuTOF)	2,000 (2,200)	4,000 (4,400)	6,000 (6,600)	1 検体 (1 時間以内)
	LC/TOFMS高分解能飛行時間型質量分析装置 (※4、※5) (JEOL AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)	2,000 (2,200)	4,000 (4,400)	6,000 (6,600)	1 検体 (1 時間以内)
	MALDI-TOFMS (Bruker autoflex II)	2,000 (2,200)	4,000 (4,400)	6,000 (6,600)	1 検体 (1 時間以内)
	MALDI-SpiralTOFMS (JEOL JMS-S3000)	2,000 (2,200)	4,000 (4,400)	6,000 (6,600)	1 検体 (1 時間以内)
	X線構造解析装置 (※6) (Rigaku SmartLab9kW/IP/HY/N)	5,000 (5,500)	10,000 (11,000)	15,000 (16,500)	1 検体 (4 時間以内)
	微小単結晶X線構造解析装置 (Rigaku VariMax RAPID RA-Micro7)	27,300 (30,030)	54,500 (59,950)	81,800 (89,980)	1 検体 (20時間以内)
	600MHz超伝導NMR (※7) (JEOL JNM-ECA600)	1,300 (1,430)	2,600 (2,860)	3,900 (4,290)	1 検体 (0.5時間以内)
	500MHz超伝導NMR (※7、※8) (JEOL JNM-ECZ500R)	1,000 (1,100)	2,000 (2,200)	2,900 (3,190)	1 検体 (0.5時間以内)

(H以外の核種 (13C等) の場合は、1 検体当たり 6 倍の利用料とする。)

(H以外の核種 (13C等) の場合は、1 検体当たり 6 倍の利用料とする。)

技術代行	400MHz固体超伝導NMR (※7、※8、※9) (JEOL JNM-ECX400P)	1,000 (1,100)	2,000 (2,200)	2,900 (3,190)	1検体 (0.5時間以内)
	(1H以外の核種(13C等)の場合は、1検体当たり6倍の利用料とする。)				
	電子スピン共鳴装置 (ESR) (JEOL JES-FA100N)	2,400 (2,640)	4,800 (5,280)	7,200 (7,920)	1検体 (4時間以内)
	電子線マイクロアナライザ (EPMA) (SHIMADZU EPMA1610)	20,000 (22,000)	40,000 (44,000)	60,000 (66,000)	1検体 (4時間以内)
	二次イオン質量分析装置 (SIMS) (ULVAC-PHI ADEPT-1010)	8,900 (9,790)	17,700 (19,470)	26,600 (29,260)	1検体 (8時間以内)
	多機能走査型X線光電子分光分析装置 (XPS) (ULVAC-PHI PHI5000VersaProbe II)	9,600 (10,560)	19,200 (21,120)	28,800 (31,680)	1検体 (8時間以内)
	顕微レーザーラマン分光光度計 (JASCO NRS-4100)	3,800 (4,180)	7,500 (8,250)	11,300 (12,430)	1検体 (4時間以内)
	円二色性分散計 (CD) (JASCO J-820)	3,400 (3,740)	6,800 (7,480)	10,200 (11,220)	1検体 (3時間以内)
	ダイナミック光散乱光度計 (Otsuka Electronics DLS-6000)	6,300 (6,930)	12,600 (13,860)	18,900 (20,790)	1検体 (6時間以内)
	分光エリプソメーター (HORIBA JOBIN YVON UVISEL ER AGMS-NSD)	5,600 (6,160)	11,100 (12,210)	16,700 (18,370)	1検体 (2時間以内)
	フェムト秒パルスレーザー (※10) (チタンサファイア) (Coherent Mira 900)	13,800 (15,180)	27,600 (30,360)	41,400 (45,540)	1検体 (8時間以内)
	サブナノ秒パルスレーザー (窒素) (※10) (USHO KEC-160)				
	ストリークスコープ (※10) (HAMAMATSU C4780)				
	全自動元素分析装置 (PerkinElmer 2400 II CHNS/O)	700 (770)	1,400 (1,540)	2,100 (2,310)	1検体 (0.5時間以内)
	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (HITACHI DSC 7000X/STA 7200)	4,500 (4,950)	9,000 (9,900)	13,500 (14,850)	1検体 (4時間以内)
	熱/電気物性評価装置 (物性評価装置: PPMS) (Quantum Design PPMS EverCool II)	6,500 (7,150)	12,900 (14,190)	19,300 (21,230)	1検体 (8時間以内)
	大気中光電子分光装置 (RIKEN KEIKI AC-3)	1,300 (1,430)	2,500 (2,750)	3,700 (4,070)	1検体 (1時間以内)
分光感度・内部量子効率測定装置 (BUNKOUKEIKI CEP-2000RP)	2,800 (3,080)	5,500 (6,050)	8,300 (9,130)	1検体 (2時間以内)	
微細形状測定装置 (Kosaka Laboratory ET200)	1,000 (1,100)	2,000 (2,200)	3,000 (3,300)	1検体 (1時間以内)	
機器利用 (※13)	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (HITACHI SU9000)	3,500 (3,850)	6,900 (7,590)	10,300 (11,330)	1時間
	低真空分析走査電子顕微鏡 (HITACHI SU6600)	3,300 (3,630)	6,500 (7,150)	9,700 (10,670)	1時間
	多機能分析走査電子顕微鏡 (JEOL IT800 (SHL))	3,600 (3,960)	7,100 (7,810)	10,500 (11,550)	1時間
	微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (※11) (HITACHI NE4000)	22,500 (24,750)	45,000 (49,500)	67,500 (74,250)	1時間
	走査プローブ顕微鏡 (SPM) (HITACHI SPA400)	1,400 (1,540)	2,700 (2,970)	4,000 (4,400)	1時間
	MALDI-TOFMS (※12) (Bruker autoflex II)	1,800 (1,980)	3,600 (3,960)	5,400 (5,940)	1時間

機器利用 (※13)	500MHz超伝導NMR (※7、※8) (JEOL JNM-ECZ500R)	2,000 (2,200)	3,900 (4,290)	5,800 (6,380)	1時間
	400MHz固体超伝導NMR (※7、※8、※9) (JEOL JNM-ECX400P)	2,000 (2,200)	3,900 (4,290)	5,800 (6,380)	1時間
	二次イオン質量分析装置 (SIMS) (ULVAC-PHI ADEPT-1010)	3,000 (3,300)	5,900 (6,490)	8,900 (9,790)	1時間
	多機能走査型X線光電子分光分析装置 (XPS) (ULVAC-PHI PHI5000VersaProbe II)	1,100 (1,210)	2,100 (2,310)	3,100 (3,410)	1時間
	顕微レーザーラマン分光光度計 (JASCO NRS-4100)	1,300 (1,430)	2,500 (2,750)	3,800 (4,180)	1時間
	円二色性分散計 (CD) (JASCO J-820)	1,200 (1,320)	2,300 (2,530)	3,400 (3,740)	1時間
	ダイナミック光散乱光度計 (Otsuka Electronics DLS-6000)	1,100 (1,210)	2,100 (2,310)	3,200 (3,520)	1時間
	分光エリプソメーター (HORIBA JOBIN YVON UVISEL ER AGMS-NSD)	1,900 (2,090)	3,700 (4,070)	5,600 (6,160)	1時間
	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (HITACHI DSC 7000X/STA 7200)	1,200 (1,320)	2,300 (2,530)	3,400 (3,740)	1時間
	熱/電気物性評価装置 (物性評価装置: PPMS) (Quantum Design PPMS EverCool II)	1,000 (1,100)	2,000 (2,200)	3,000 (3,300)	1時間
	大気中光電子分光装置 (RIKEN KEIKI AC-3)	1,300 (1,430)	2,500 (2,750)	3,700 (4,070)	1時間
	分光感度・内部量子効率測定装置 (BUNKOUKEIKI CEP-2000RP)	900 (990)	1,800 (1,980)	2,700 (2,970)	1時間
	微細形状測定装置 (Kosaka Laboratory ET200)	1,000 (1,100)	2,000 (2,200)	3,000 (3,300)	1時間
協力研究 (※14)	50,000	100,000	150,000	1期口	

- ・利用時間に装置の立ち上げ・立ち下げに係る時間を含む。また、利用時間は原則として平日の9時から17時までの間とする。
- ・技術代行において1検体当たりの標準測定時間を超過する場合又は特別な観察若しくは分析に必要な処理を要する場合は、規定の利用料に加え、別途実費相当額を利用料として徴収することがある。
- (※1) EELS、電子回折法及びクライオ電子顕微鏡法による測定はできない。
- (※2) 1検体では、ポジティブモード又はネガティブモードのどちらか1モードでの測定となる。両モードの測定を希望する場合は、2検体となる。
- (※3) GC利用の場合は、再現性確認のために2回にわたって測定を行うことから、1検体当たり2倍の利用料を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として1測定当たり別途3検体分の利用料を徴収する。
- (※4) 本学のカラムを利用する場合は、1検体当たり別途1,000円(消費税を除く。)の利用料を徴収するとともに、測定に時間を要するため1検体当たり3倍の利用料を徴収する。また、本学で移動相を用意する場合は、1検体当たり別途500円(消費税を除く。)の利用料を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として、LC条件提示が有る場合は1測定当たり別途4検体分、LC条件提示が無い場合は1測定当たり別途8検体分の利用料を徴収する。
- (※5) CSI測定の場合は、装置の起動に係る料金として1測定当たり別途1検体分の利用料を徴収する。
- (※6) 1測定当たりの測定時間は最大4時間(装置の立ち上げに係る時間としての1時間を含む。)とし、これを超える場合は、以降3時間ごとに1検体分の利用料を徴収する。また、オプションユニットを利用して測定した場合は、その測定の種類に応じ、条件調整に係る料金として、1測定当たり別途次の利用料を徴収する。
 - ①CuK α 1単色化用Ge(220)2結晶法の場合:1,000円(消費税を除く。)
 - ②環境雰囲気ユニットを用いた測定の場合:1,000円(消費税を除く。)
 - ③逆格子マップ測定の場合:10,000円(消費税を除く。)
 - ④インプレーン測定の場合:5,000円(消費税を除く。)
 - ⑤2DXRD測定の場合:5,000円(消費税を除く。)
 - ⑥昇温測定の場合:10,000円(消費税を除く。)
- (※7) 溶液試料測定に用いる重水素化溶媒は、利用者が用意する。
- (※8) 1測定当たりの測定時間は、最大3時間とする。
- (※9) 固体サンプルについては技術代行のみ可能とする。

- (※10) 利用機器の使用数にかかわらず、1検体当たりの利用料とする。
- (※11) 本学のプローブを利用する場合は、1プローブ当たり別途20,000円（消費税を除く。）の利用料を徴収する。
- (※12) プレートについては利用者が持込み、サンプル等のプリパレーションについては利用者が用意した後に利用とすることを基本とする。なお、本学のプレートを利用し、サンプル等のプリパレーションを本学で用意する場合は、1測定当たり別途5,000円（消費税を除く。）の利用料を徴収する。
- (※13) 機器利用の利用者は、あらかじめ、機器操作に関する講習（1講習当たり4時間以内を想定）を受講することを基本とし、講習に係る料金として別途1講習当たり10,000円（消費税を除く。）の利用料を徴収する。
- (※14) 4月～12月を対象とし、利用申請を受け付ける。